

(19)



(11)

EP 2 564 196 B8

(12)

KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(15) Korrekturinformation:

Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 72, 73

(51) Int Cl.:

G01N 33/558 ^(2006.01) **G01N 33/94** ^(2006.01)
B01L 3/00 ^(2006.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:

23.12.2015 Patentblatt 2015/52

(86) Internationale Anmeldenummer:

PCT/EP2011/056550

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:

04.11.2015 Patentblatt 2015/45

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 2011/134946 (03.11.2011 Gazette 2011/44)

(21) Anmeldenummer: **11719501.6**

(22) Anmeldetag: **26.04.2011**

(54) **Mikrofluidiksystem mit Probenvorbehandlung**

Microfluidic system with sample pre-treatment

Système microfluidique doté d'un prétraitement d'échantillons

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

- **STADTHAGEN, Torsten**
81475 München (DE)
- **KLAUS, Sebastian**
82061 Neuried (DE)

(30) Priorität: **26.04.2010 EP 10161025**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
06.03.2013 Patentblatt 2013/10

(74) Vertreter: **Weickmann & Weickmann**
Postfach 860 820
81635 München (DE)

(73) Patentinhaber: **Securetec Detektions-Systeme AG**
85579 Neubiberg (DE)

(56) Entgegenhaltungen:

EP-A1- 0 634 215 EP-A2- 0 811 847
WO-A1-01/35094 US-B1- 6 203 757

(72) Erfinder:

- **ABERL, Franz**
85402 Kranzberg (DE)

Bemerkungen:

Die Akte enthält technische Angaben, die nach dem
Eingang der Anmeldung eingereicht wurden und die
nicht in dieser Patentschrift enthalten sind.

EP 2 564 196 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).